

微小部X線回折法による物質の同定

1.概要もしくは特長

X線回折測定は物質の同定を行うにあたり、非常に優れた方法ですが、一般的なX線回折測定は数cmオーダーの試料が対象となります。

弊社では通常のX線回折装置よりも微小な数mm～サブmmオーダーの試料を測定できるX線回折装置を所有しています。

応用分野は微量試料、精密部品、微小な異物や付着物の分析など多岐にわたります。

2.装置仕様等

- ・ X線源：Cu管球、Co管球
- ・ コリメーター：0.2mm～0.05mm
- ・ 検出器：2次元検出器

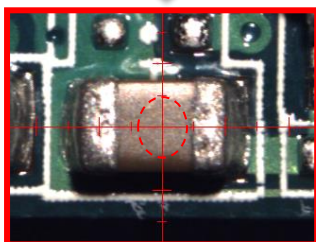
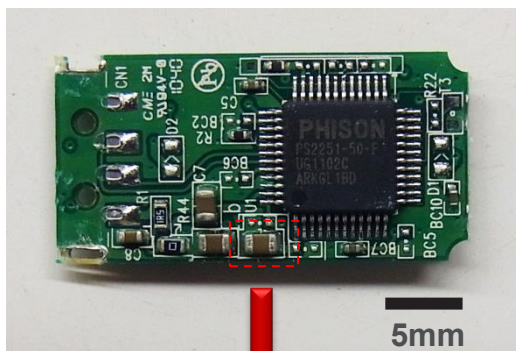
3.試料情報

- ・ 測定領域：～0.1mm
- ・ 設置可能試料サイズ：20cm×20cm×5cm以内。それ以上のサイズはご相談ください。

4.測定事例:電子基板の分析

微小部XRDにより、電子基板中の精密部品1個を狙った分析を行いました。

周辺の材質の影響を受けることなく、1mm程度の部品の材質の同定ができました。



微小部X線回折パターン

